01,07

Особенности электронной структуры систем Zr-He, Zr-H, Zr-He-H

© О.В. Лопатина¹, Л.А. Святкин¹, Ю.М. Коротеев², И.П. Чернов¹

² Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия

² Институт физики прочности и материаловедения СО РАН,

Томск, Россия

E-mail: lopatina_oksana@tpu.ru

(Поступила в Редакцию 31 марта 2015 г.)

Выполнены *ab initio* расчеты электронной структуры систем Zr–H, Zr–He и Zr–He–H. Рассмотрено влияние примеси водорода и гелия на электронную структуру ГПУ-Zr. Установлено, что 1*s*-состояния гелия формируют узкую зону ниже дна зоны проводимости Zr. Водород, растворяясь в цирконии, не создает дополнительной зоны подобно гелию, а отщепляет от дна зоны проводимости металла зону гибридизованных металл-водородных состояний, образуя химическую связь. Обнаружено, что гелий формирует слабую химическую связь с атомами металла в результате гибридизации его 2*s*-состоянний с валентными состояниями Zr. Гелий приводит также к усилению ковалентной составляющей связи между атомами Zr первой координационной сферы.

1. Введение

На протяжении нескольких последних десятилетий широко исследуется поведение легких газовых примесей в металлах [1–3]. Особый интерес проявляется к изучению влияния атомов водорода и гелия на свойства конструкционных материалов ядерных реакторов. Наработка этих примесей происходит в результате (n, p)-, (n, α) -ядерных реакций при бомбардировке металлов нейтронами. Дополнительно атомарный водород аккумулируется в конструкционных материалах при радиолизе воды, использующейся в качестве теплоносителя в водо-водяных энергетических реакторах (ВВЭР). Что касается гелия, то он может проникать в материалы еще и в результате заполнения им газовых зазоров тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ).

Накопление в приповерхностной области металла атомов водорода и гелия приводит к образованию твердого раствора с высокой концентрацией примеси и, как следствие, вызывает водородное и гелиевое охрупчивание, а также газовое распухание материала. Все это значительно ухудшает эксплуатационные свойства металлов и сплавов [4–7]. В связи с этим возникает необходимость детального изучения влияния примеси водорода и гелия на электронную структуру металлов и сплавов на его основе.

Целью настоящей работы является теоретическое *ab initio* исследование влияния примесей H и He совместно и по отдельности на электронную структуру и свойства циркония, сплавы которого широко используются в качестве конструкционных материалов ТВЭЛ активной зоны ВВЭР.

2. Детали расчета

В рамках теории функционала электронной плотности с использованием обобщенного градиентного прибли-

жения [8] линеаризованным методом присоединенных плоских волн [9,10], реализованным в пакете программ FLEUR, выполнены самосогласованные расчеты электронной структуры систем Zr-He, Zr-H и Zr-He-H с концентрацией примеси по \sim 6 at.%. Радиусы muffin-tin (MT) сфер атомов Zr выбирались равными 2.3 атомных единиц (a.u.), а атомов примеси Не и Н — по 1.0 a.u. Использованный параметр обрезания базиса из плоских волн $k_{\rm max} = 4.0 \, {\rm a.u.}^{-1}$ соответствовал ~ 170 базисным функциям на атом. На каждой итерации самосогласования собственные значения гамильтониана рассчитывались в 14 k-точках зоны Бриллюэна гексагональной плотноупакованной структуры. Процедура самосогласования электронной плотности проводилась до достижения сходимости полной энергии не хуже 0.001 meV, что соответствовало сходимости зарядовой плотности не хуже $1 \cdot 10^{-7} e/a.u.^3$, где e — заряд электрона. Расчетная ячейка систем Zr-He, Zr-H содержала 16 атомов металла и один атом примеси гелия в октаэдрическом и водорода в тетраэдрическом междоузлии. Расчетная ячейка системы Zr-He-H содержала 16 атомов металла, один атом гелия и один атом водорода в соответствующих междоузлиях.

Плотности электронных состояний (ПЭС) рассчитаны линейным методом тетраэдронов на сетке из 54 *k*-точек в зоне Бриллюэна. Сглаживание ПЭС осуществлялось гауссианами со среднеквадратичной шириной 0.13 eV.

3. Результаты и обсуждение

Выполненные нами ранее расчеты полной энергии систем Zr-He, Zr-H и Zr-He-H [11–13] для гексагональной плотноупакованной (ГПУ), гранецентрированной кубической и объемно центрированной кубической структур циркония показали, что в случае присутствия ~ 6 аt.% примеси гелия и/или водорода наиболее стабильной из всех рассмотренных нами структур является ГПУ-решетка металла. Предпочтительным положением для атома гелия в этом случае оказывается октаэдрическое междоузлие, а для атома водорода — тетраэдрическое. Именно для этих положений примеси в настоящей работе и рассмотрена электронная структура систем Zr-He, Zr-H и Zr-He-H.

3.1. Плотность электронных состояний. На рис. 1 представлены рассчитанные в работе кривые ПЭС чистого Zr и систем Zr-He, Zr-H, Zr-He-H в случае, когда атомы гелия находятся в октаэдрическом, а атомы водорода — в тетраэдрическом междоузлии ГПУрешетки металла. В нижнем ряду показана полная плотность электронных состояний. Во втором ряду снизу приведены локальные плотности электронных состояний в межатомной области и МТ-сферах атомов циркония, гелия и водорода. В трех верхних рядах показаны локальные парциальные плотности состояний *s*-, *p*- и *d*-типа в МТ-сферах атомов Не и H, а также атомов Zr первой координационной сферы примеси для систем Zr-He, Zr-H и Zr-He-H.

Панели нижнего ряда свидетельствуют, что при рассматриваемой нами концентрации водорода и гелия не происходит значительного изменения ПЭС циркония. Четырехпиковая структура ПЭС, характерная для переходных ГПУ-металлов четвертой группы, искажается слабо. Панели второго ряда снизу показывают, что примерно половина валентной зарядовой плотности металла находится в межатомной области, а оставшаяся ее часть — в МТ-сферах его атомов.

Из анализа полной ПЭС следует, что внедрение гелия в октапору Zr (нижний ряд колонки b) приводит к появлению узкой (шириной $\sim 0.8 \,\mathrm{eV}$) зоны *s*-состояний He, лежащей на 12 eV ниже дна зоны валентных состояний Zr, и уменьшению примерно на $\sim 0.2\,\mathrm{eV}$ ширины валентной зоны металла. В результате этого ПЭС металла в занятой части спектра повышается, и ее увеличение на уровне Ферми составляет 5.5 states/(eV·cell). При растворении водорода в тетрапоре решетки металла (колонка c) ниже дна валентной зоны Zr появляется узкий пик шириной ~ 1.0 eV, соответствующий гибридизованным металл-водородным состояниям, образованным преимущественно *s*-орбиталями водорода (~ 66%), что уменьшает ширину валентной зоны металла примерно на 0.4 eV. Кроме того, присутствие водорода в решетке Zr повышает ПЭС на уровне Ферми на 2 states/(eV·cell) относительно значения для чистого циркония. Таким образом, и при растворении водорода, и при внедрении гелия следует ожидать повышения степени металличности циркония.

Совместное внедрение водорода и гелия (колонка d рис. 1) приводит к уменьшению ширины зоны проводимости Zr примерно на 0.6 eV. Это значение соответствует суммарному уменьшению ширины зоны проводимости металла, обусловленному каждой примесью в отдельности. В системе Zr-He-H также наблюдается повышение ПЭС металла на уровне Ферми (6.5 states/eV·cell)), превышающее соответствующие

величины для систем Zr-He и Zr-H, но меньшее, чем их суммарное значение. Пики ПЭС, образованные 1s-состояниями H и He, смещены относительно их положения в системах Zr-H и Zr-He на -0.12 и 0.14 eV соответственно. Последнее обстоятельство, повидимому, свидетельствует о наличии взаимодействия водорода с гелием в Zr.

Колонки b и c на рис. 1 отчетливо демонстрируют, что примеси водорода и гелия по-разному влияют на электронную структуру циркония. В частности, перекрытие ПЭС водорода и металла в занятой части спектра свидетельствует о гибридизации 1s-состояний водорода с валентными состояниями металла, тогда как 1s-состояния гелия образуют слабо диспергирующую глубоколежащую зону, не перекрывающуюся с состояниями циркония. Вместе с тем незанятые в атомарном гелии 2s-состояния образуют довольно широкую зону выше уровня Ферми (примерно при 3 eV) системы Zr-He и проникают в область занятых состояний циркония, гибридизуясь с ними. Однако из-за низкой плотности занятых 2s-состояний гелия степень этой гибридизации невелика. Поэтому связь Zr-He слабая. Этим взаимодействие циркония с гелием существенным образом отличается от его взаимодействия с водородом.

Колонка *d* на рис. 1 показывает совместное влияние рассматриваемых примесей на электронные свойства циркония. Так, можно видеть, что присутствие водорода практически не повлияло на плотность *s* и *p* состояний Не в рассматриваемом энергетическом интервале, за исключением области энергий преимущественной локализации 1*s*-состояний водорода (около 6.5 eV). Гелий же, напротив, заметно изменил ПЭС водорода, уменышив ее в области от -6 до -1 eV и увеличив в незанятой части спектра (от 2 до 4 eV). Это приводит к уменышению энергии связи водорода с Zr и может способствовать выходу водорода из металла при более низких температурах. Наконец, перекрытие ПЭС водорода и гелия в занятой части спектра свидетельствует о наличии связи H–He.

Анализ локальных парциальных ПЭС *s*-, *p*- и *d*-типа в МТ-сферах атомов Zr второй координационной сферы для системы Zr–He–H дает основание утверждать, что атомы водорода и гелия взаимодействуют только с ближайшими атомами циркония. Об этом свидетельствует отсутствие пиков ПЭС металла в области энергий 1s-состояний водорода и гелия, отчетливо наблюдаемых для атомов циркония первой координационной сферы в колонках *b*, *c* и *d*.

3.2. Зарядовая плотность. Важная информация о влиянии водорода и гелия на электронную структуру Zr может быть получена из анализа распределения валентной зарядовой плотности чистого циркония и систем Zr-He, Zr-H и Zr-He-H. На рис. 2–4 представлены распределения валентной зарядовой плотности чистого циркония, а также перечисленных выше систем, содержащих по ~ 6 at.% гелия и водорода. Рис. 2 демонстрирует зарядовую плотность в плоскости



Рис. 1. Плотность электронных состояний (DOS) чистого Zr (*a*) и систем Zr–He (*b*), Zr–H (*c*) и Zr–He–H (*d*). Показаны полная плотность электронных состояний (Total), локальная плотность электронных состояний в межатомной области (Int) и MT-сферах атомов циркония, гелия и водорода, а также локальные парциальные плотности состояний *s*-, *p*- и *d*-типа.

(11 - 1/20), перпендикулярной базальной кристаллографической плоскости (0001) ГПУ-решетки и проходящей через атомы циркония, гелия и водорода. Сверху приведены профили зарядовой плотности, рассчитанные вдоль направлений, отмеченных светлыми линиями. На рис. 3 и 4 показана валентная зарядовая плотность в двух плоскостях, параллельных базальной плоскости (0001) ГПУ-структуры, проходящих соответственно через атом гелия в октаэдрическом междоузлии и атом водорода в тетраэдрическом. Анализ рис. 2, b-4, b показал, что гелий, внедренный в октаэдрическое междоузлие циркония, формирует связь с ближайшими атомами металла, о чем свидетельствует наличие общего контура изолиний вокруг них (рис. 2, b), а также повышенная (по сравне-

нию со значением в незанятом междоузлии) плотность валентного заряда между ними (верхняя панель на рис. 2, b). На возникновение такой связи за счет гибридизации 2*s*-состояний гелия указывалось при обсуждении плотности электронных состояний. Кроме того, гелий приводит к усилению ковалентной составляющей связи между атомами Zr первой координационной сферы, что следует из общего контура изолиний, охватывающих эти атомы Zr на рис. 3, b.

Рис. 2, *c*-4, *c* ясно демонстрируют возникновение сильной химической связи между атомами водорода и циркония. Об этом свидетельствуют большое число изолиний, охватывающих атомы Zr и H (рис. 2, *c* и 4, *c*), и значительный уровень плотности валентного заряда



Рис. 2. Распределение валентной зарядовой плотности $\rho(\mathbf{r})$ чистого циркония (*a*) и систем Zr–He (*b*), Zr–H (*c*) и Zr–He–H (*d*) в плоскости (11 – ¹/₂0), проходящей через атомы металла и примеси. На частях *e*–*g* показаны отрицательные, а частях *h*–*j* — положительные значения разности плотностей $\Delta \rho(\mathbf{r})$ для каждой из систем. Стрелками указаны положения атомов или их проекции на рассматриваемую плоскость. Цифрами *1* и *2* помечены атомы Zr первой и второй координационных сфер. Сверху представлены профили распределения зарядовой плотности вдоль направлений, показанных светлой линией. Горизонтальная штриховая линия — уровень зарядовой плотности в межатомной области.

между ними, превышающий значение в незанятом междоузлии примерно в 4 раза (верхняя панель на рис. 2, c).

Размещаясь в соседних междоузлиях решетки циркония, атомы водорода и гелия образуют химические связи не только с атомами металла, но и между собой. На это указывает наличие общего контура изолиний вокруг этих атомов на рис. 2, d и 3, d, а также повышенная (по сравнению с межатомной областью) плотность валентного заряда между ними (верхняя панель на рис. 2, d). Сравнительный анализ распределений зарядовой плотности в системах Zr-He, Zr-H и Zr-He-H показал, что растворение водорода в системе Zr-He слабо влияет на связь между атомами Zr и He (зарядовая плотность между ними практически не меняется). С другой стороны, внедрение гелия в систему Zr-H приводит к ослаблению связи металла с водородом (зарядовая плотность между этими атомами понижается примерно на 20% (верхние панели на рис. 2, *c*, *d*). Все эти выводы полностью согласуются с результатами нашего анализа ПЭС рассматриваемых систем.

Для выявления особенностей взаимодействия водорода и гелия с цирконием, а также их взаимного влияния друг на друга проведен детальный анализ перераспределения зарядовой плотности металла, обусловленного присутствием примеси. На частях e-g и h-j рис. 2–4 показаны соответственно отрицательные и положительные значения разности плотностей $\rho(\mathbf{r})$ рассматриваемых систем и их компонентов. Например, для системы Zr–He–H эта величина определялась по формуле

$$\Delta \rho(\mathbf{r}) = \rho_{\mathrm{Zr-He-H}}(\mathbf{r}) - \rho_{\mathrm{Zr}}(\mathbf{r}) - \rho_{\mathrm{He}}(\mathbf{r}) - \rho_{\mathrm{H}}(\mathbf{r}).$$

Таким образом, на частях e-g можно видеть области кристалла Zr, из которых валентный заряд уходит, а на частях h-j — области, куда он приходит в результате присутствия примесей.

Из показанной на частях e-j разности плотностей $\Delta \rho(\mathbf{r})$ видно, что наличие примеси в междоузлии ГПУ-решетки циркония приводит к заметному перераспределению валентной зарядовой плотности металла, затухающему с увеличением расстояния от примеси. В частности, гелий практически полностью вытесняет из занимаемого им октаэдрического междоузлия электроны металла (часть e) в межатомную область атомов Zr первой координационной сферы (рис. 2, h). Кроме того, он приводит к неоднородному перераспределению зарядовой плотности в МТ-сферах ближайших атомов Zr



Рис. 3. Распределение валентной зарядовой плотности $\rho(\mathbf{r})$ чистого ГПУ-Zr (*a*) и систем Zr-He (*b*), Zr-H (*c*) и Zr-He-H (*d*) в плоскости, проходящей через атом гелия и параллельной базальной плоскости (0001) ГПУ-структуры. На частях e-g показаны отрицательные, а на частях h-j — положительные значения разности $\Delta\rho(\mathbf{r})$ валентных плотностей систем Zr-He, Zr-H и Zr-He–H соответственно.



Рис. 4. Распределение валентной зарядовой плотности $\rho(\mathbf{r})$ чистого ГПУ-Zr (*a*) и систем Zr–He (*b*), Zr–H (*c*) и Zr–He–H (*d*) в плоскости, параллельной базальной плоскости семейства (0001) ГПУ-структуры, проходящей через атом водорода. На частях e-g показаны отрицательные, а на частях h-j — положительные значения разности $\Delta \rho(\mathbf{r})$ валентных плотностей систем Zr–He, Zr–H, Zr–He–H соответственно.

(рис. 2, e, h). В результате валентный заряд в МТ-сферах этих атомов Zr увеличивается на 0.022e, а в остальных МТ-сферах атомов Zr уменьшается на 0.015e по сравнению с характерным для чистого металла. При этом заряд в МТ-сфере гелия увеличивается лишь на 0.007eотносительно аналогичного значения для свободного атома гелия.

Растворение водорода в цирконии, напротив, приводит к увеличению электронной плотности в занимаемом им тетраэдрическом междоузлии (рис. 2, i) и ее уменьшению в межатомной области атомов Zr первой координационной сферы (рис. 2, f). Расчеты показали, что MT-сфера изолированного атома водорода содержит электронный заряд 0.290e, а в системе Zr—H этот заряд увеличивается до 0.503e. Это указывает на перенос электронной плотности из межатомной области металла в MT-сферу водорода. В MT-сферах ближайших к водороду атомов Zr валентный заряд увеличивается по сравнению с чистым металлом на 0.012e для атомов в основании тетраэдра и на 0.002e для атома в его вершине, что, по-видимому, свидетельствует о различном типе связывания водорода с этими атомами.

Из приведенной на рис. 2, g, j разности плотностей $\Delta \rho(\mathbf{r})$ видно, что в системе Zr–He–H характер влияния рассматриваемых примесей на распределение электронной плотности металла в целом такой же, как в системах Zr-Не и Zr-Н: водород увеличивает электронную плотность металла в области занимаемого им междоузлия, а гелий уменьшает ее. Наиболее заметно совместное влияние Н и Не на электронную плотность металла проявляется в межатомной области атомов Zr первой координационной сферы примесей. Валентный заряд в МТ-сферах атомов Н и Не увеличивается соответственно на 0.025е и 0.001е по сравнению с его значением в системах Zr-H и Zr-He, т.е. внедрение Не в систему Zr-Н приводит к дополнительному переносу электронного заряда в МТ-сферу водорода, а растворение Н в системе Zr-Не практически не изменяет зарядового состояния гелия. При этом валентный заряд в МТсферах ближайших атомов Zr увеличивается на 0.028е, а в остальных МТ-сферах атомов Zr уменьшается на 0.0203е по сравнению с чистым металлом.

Анализ перераспределения валентной электронной плотности в базальных плоскостях, проходящих через атомы примеси в системах Zr–He, Zr–H и Zr–He–H, показал, что присутствие гелия является определяющим фактором в формировании распределения электронной плотности системы Zr–He–H, тогда как влияние водорода носит преимущественно локальный характер.

4. Заключение

В рамках теории функционала плотности выполнены *ab initio* расчеты электронной структуры систем Zr-He, Zr-H и Zr-He–H, а также чистого Zr. Анализ полученных результатов показал, что при концентрации ~ 6 at.% рассмотренные примеси по-разному изменяют электронную структуру циркония. Так, 1*s*-состояния гелия формируют узкую зону, лежащую примерно на 12 eV ниже дна зоны проводимости металла. Водород же, растворяясь в цирконии, не создает дополнительной зоны подобно гелию, а отщепляет от дна зоны проводимости металла зону гибридизованных $s^{\rm H} - (s-, p-, d-)^{\rm Zr}$ состояний, образуя химическую связь. Обнаружено, что незанятые в атомарном гелии 2*s* состояния при его внедрении в Zr участвуют в формировании слабой химической связи с атомами металла. Кроме того, гелий приводит к усилению ковалентной составляющей связи между атомами Zr первой координационной сферы, что, по-видимому, может являться одним из факторов охрупчивания циркония в результате внедрения гелия.

Рассматривая систему Zr-He-H как результат растворения водорода в системе Zr-He или внедрения гелия в систему Zr-H, мы установили, что присутствие водорода не оказывает заметного влияния на взаимодействие гелия с металлом, тогда как внедрение гелия приводит к уменьшению энергии связи Zr-H. Размещаясь в соседних междоузлиях решетки циркония (система Zr-He-H), атомы водорода и гелия образуют химические связи не только с атомами металла, но и между собой. Внедрение He в систему Zr-H приводит к дополнительному переносу электронного заряда в МТ-сферу водорода, а растворение H в системе Zr-He практически не изменяет зарядового состояния гелия.

Список литературы

- [1] Взаимодействие водорода с металлами / Отв. ред. А.П. Захаров. Наука, М. (1987). 296 с.
- [2] S.M. Myers. Rev. Mod. Phys. 64, 559 (1992).
- [3] J. Zheng, H. Zhang, X. Zhou, J. Liang, L. Sheng, S. Peng. Adv. Cond. Matter Phys. 2014, 929 750 (2014).
- [4] В.Ф. Зеленский, И.М. Неклюдов, Т.П. Черняева. Радиационные дефекты и распухание металлов. Наук. думка, Киев (1988). 294 с.
- [5] S. Nagata, K. Takahiro, S. Yamaguchi, S. Yamamoto, B. Tsuchiya, H. Naramoto. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B 136–138, 680 (1998).
- [6] А.Г. Залужный, Ю.Н. Сокурский, В.Н. Тебус. Гелий в реакторных материалах. Энергоатомиздат, М. (1988). 224 с.
- [7] H. Ullmaier. Nucl. Fusion **24**, 1039 (1984).
- [8] J.P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof. Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).
- [9] E. Wimmer, H. Krakauer, M. Wienert, A.J. Freeman. Phys. Rev. B 24, 864 (1981).
- [10] M. Wienert, E. Wimmer, A.J. Freeman. Phys. Rev. B 26, 4571 (1982).
- [11] Ю.М. Коротеев, О.В. Лопатина, И.П. Чернов. ФТТ **51**, 1509 (2009).
- [12] О.В. Лопатина, Ю.М. Коротеев, И.П. Чернов. ФТТ 56, 973 (2014).
- [13] Л.А. Святкин, Ю.М. Коротеев, И.П. Чернов. Изв. вузов. Физика 55, 271 (2012).